УДК 539,216,539,26:546,162

В.Ф. Зінченко<sup>1</sup>, Н.П. Єфрюшина<sup>1</sup>, І.В. Стоянова<sup>1</sup>, В.П. Антонович<sup>1</sup>, О.Г. Єрьомін<sup>1</sup>, Н.М. Білявина<sup>2</sup>, В.Я. Марків<sup>2</sup>, О.В. Мозкова<sup>3</sup>

## Вплив термообробки у вакуумі на оптичні властивості плівкоутворюючого матеріалу EuF<sub>3</sub>

<sup>1</sup>Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Люстдорфська дорога, 86, Одеса, 65080, Україна, тел. 0482-61-82-25, E-mail: <u>physchem@paco.net</u>

<sup>2</sup>Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01003, Україна, тел. 044-266-23-35, E-mail: <u>belmar@mail.kiev.ua</u>

<sup>3</sup>Центральне конструкторське бюро "Арсенал", вул Московська., 8, Київ, 01010, Україна, тел. 044-254-59-08, E-mail: borisgor@i.com.ua

Вивчено вплив умов синтезу на кристалічну структуру та оптичні властивості трифториду європію. Встановлено можливість часткового відновлення Eu (III) до Eu (II) у процесах високотемпературної обробки у відновлювальному середовищі та вакуумі. Вивчено оптичні та експлуатаційні властивості тонкоплівкових покриттів, отриманих нанесенням вихідного  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> методами термічного випаровування. Показано, що в залежності від технології виготовлення покриття воно містить або  $\beta$ -EuF<sub>3</sub>, або суміш з  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> та  $\beta$ -EuF<sub>3</sub> поліморфних форм.

Ключові слова: європій фторид, валентний стан, структура, тонкоплівкове покриття.

Стаття поступила до редакції 10.02. 2003 р., прийнято до друку 15.05. 2003 р.

#### I. Вступ

Європій посідає особливе місце у лантанідному ряді у зв'язку з його здатністю при утворенні сполук перебувати у валентних станах Eu(III) та Eu(II) в залежності від складу та типу аніонної підгратки. Зокрема, у фторидних та оксидних сполуках більш стабільним є Eu(III), у той час як у халькогенідах він перебуває переважно у валентному стані Eu (II) [1].

Відомо, що при взаємодії європію та фтору утворюються сполуки  $EuF_3$  та  $EuF_{2+x}$  (x = 0-0,4). Результати дослідження характеру фазових рівноваг в області, яка прилягає до сполуки EuF2, та кристалічну структуру ЕиF<sub>2+x</sub>. наведено в [2]. Кристалографічні характеристики сполуки EuF<sub>3</sub> і її термодинамічні параметри вивчені в [3, 4]. Зокрема, встановлено, що EuF<sub>3</sub> кристалізується в двох поліморфних модифікаціях: високотемпературній (β-EuF<sub>3</sub>) і низькотемпературній (α-EuF<sub>3</sub>). Згідно даних [3] кристалічна структура β-ЕиF<sub>3</sub> належить до структури типу тизоніту (просторова група РЗс1; a = 6,9204 Å, c = 7,0856 Å), а  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> – до структури типу anti-Fe<sub>3</sub>C (*Pnma*; a = 6,6105 Å, b = 7,0157 Å, c = 4,3959 Å. Мета даної роботи – встановлення впливу технологічних параметрів синтезу та нанесення покриття на валентний стан європію в EuF<sub>3</sub> та кристалічну структуру цієї сполуки.

#### **II. Експериментальні методи**

Синтез зразків фториду європію (III) проводили шляхом послідовного розчинення оксиду європію високої чистоти (вміст понад 99,9%) у соляній кислоті з наступним осадженням EuF<sub>3</sub> за допомогою концентрованої  $H_2F_2$ . Осад ретельно промивали, висушували над плавленим лугом у вакуумі (для остаточного видалення залишків води та кислоти) та витримували 15-20 хв. при 500°С. Частину продукту перетоплювали у графітових тиглях в інертному (гелій) середовищі, а другу частину – спікали при 1000°С у вигляді пігулки. Отримані матеріали відрізнялися за кольором: плавлений мав білий з жовтуватим відтінком колір, а спечений зразок – чисто білий колір.

Фазовий склад проб та кристалічну структуру досліджували фазових складових методами рентгенівського та рентгеноструктурного аналізів. Дифракційні спектри одержували на автоматизованому рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3 у дискретному режимі (мідне фільтроване випромінювання, крок сканування (0,02-0,05)<sup>0</sup>, час експозиції у кожній точці (4-8) с). Первинну обробку дифракційних спектрів проводили за методом повнопрофільного аналізу. Положення центрів ваги піків визначали з похибкою  $\pm (0,001 \div 0,005)^0$ , а інтегральні інтенсивності – з ±(5÷15)%. Фазовий



2theta [deg]

**Рис. 1.** Фрагменти рентгенівських дифракційних спектрів (експеримент – точки, розрахунок – суцільна лінія) α-EuF<sub>3</sub> в пробі 1(а) та β-EuF<sub>3</sub> в пробі 8 (b).

аналіз та структурні розрахунки проводили за допомогою оригінальних прикладних програм [5].

Враховуючи можливість утворення в залишках човників-випарювачів значної кількості EuF<sub>2</sub>, аналізу було проведено методами хімічного визначення кількості Eu (II) як в вихідних матеріалах, так і в матеріалах залишків. Вміст Ец (II) в зразках визначали за його здатністю до окиснення. До наважки зразка масою (0,03÷0,05) г додавали 5 мл 0,025 М розчину сполуки ванадію (V), 10 мл концентрованої Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> та нагрівали до повного її розчинення (титрований розчин солі V(V)використовували для запобігання окисненню Eu (II) іонами Н<sup>+</sup>). До гарячого розчину додавали 5 мл 9 М H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, розводили водою до ~ 50 мл і титрували надлишок окиснювача розчином сульфату заліза (II) з фенілантраніловою кислотою (індикатор). Паралельно проводили контрольний дослід без Е (II).

Оптичні властивості полікристалічних зразків вихідних фторидів ïx залишків та після випаровування досліджували методом електронної спектроскопії дифузного відбиття. Спектри дифузного відбиття порошків знімали у діапазоні довжин хвиль (200 – 900) нм ((50000 – 11000)см<sup>-1</sup>) на спектрофотометрі "Specord M40". Взірцем слугував фторид магнію, який у зазначеному спектральному

діапазоні є прозорим.

Тонкоплівкові покриття наносили з пігулок фториду європію (III) на нагріті до 200°С підкладки з оптичного скла К8, германію або силіцію методом термічного випаровування (установка ВУ-1А, залишковий тиск (2÷3) ·10<sup>-3</sup> Па). Випаровування відбувалося під дією електронного променя (струм емісії 30 мA) або резистивним шляхом 3 молібденових човників-випарювачів (струм нагріву до 120 А) зі швидкістю нанесення (25-30) нм/хв. (nd)покриттів Оптична товшина становила (0,8÷2.4) мкм. Показник заломлення покриття визначали на мікроспектрофотометрі МСФУ за коефіцієнтом відбиття (R) від клиновидної пластини [6]. Коефіцієнт розсіювання (о) від покриття, яке нанесене на підкладку з кварцового оптичного скла, вимірювали на лазерному стенді (He-Ne лазер,  $\lambda = 682 \text{ HM}$ ).

Адгезію покриття до підкладки оцінювали візуально за станом покриття безпосередньо після його нанесення та після протирання серветкою зі спиртом. Механічну міцність покриттів визначали на пристрої СМ-55 методом стирання покриття гумовим стрижнем, обгорнутим батистовою тканиною, за кількістю обертів до руйнування покриття (до появи кільцеподібної подряпини). Кліматичну стійкість



Рис. 2. Спектри дифузного відбиття для спеченого (1 – проба 1) та плавленого (2 – проба 6) зразків EuF<sub>3</sub>, залишку зразка спеченого EuF<sub>3</sub> після термічного резистивного випаровування (3 – проба 2) та після електронно-променевого випаровування (4 – проба 4), залишку зразку плавленого EuF<sub>3</sub> після термічного резистивного випаровування (5 – проба 7).

покриттів визначали у кліматичній камері при відносній вологості 98 % і температурі  $40^{\circ}$  С. Термічну стійкість оцінювали за здатністю витримували термоудар у діапазоні перепаду температур  $\pm 60^{\circ}$  С при тривалості витримки (3-5) хв. шляхом якісної оцінки стану покриття.

#### **III.** Результати експерименту

Результати рентгенівського дифракційного дослідження показують, що термооброблені вихідні продукти синтезу  $\operatorname{EuF}_3$  (спечений чисто білого кольору зразок (проба 1) та плавлений білого кольору з жовтуватим відтінком зразок (проба 6) є однофазними. Їх дифракційні спектри (один з яких зображено на рис. 1а) добре індексуються в ромбічній гратці (періоди наведено в табл. 1), тобто відповідають  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub>.

Дифракційні спектри покриттів, які наносили резистивним методом від кожного з вихідних продуктів, однакові (рис. 1b), проте суттєво відрізняються від дифракційних спектрів проб 1 та 6 (рис. 1а). Вони добре індексуються в гексагональній гратці з періодами, які наведено в табл. 1. Беручи до уваги дані про існування У EuF<sub>2</sub> високотемпературної модифікації [3], за початкову модель при розрахунку структури EuF<sub>3</sub> в покриттях, було прийнято структурний тип тизоніту (центросиметрична просторова група P 3 c1). Ha недостатня кількість жаль, відбиттів на дифракційному спектрі сильно текстурованого покриття проби 3 (рис. 1b) не дозволило коректно провести уточнення координат атомів його кристалічної структури. Однак проведені розрахунки свідчать, що, найймовірніше, розподіл атомів в структурі відповідає стехіометричній формулі EuF<sub>3</sub>



**Рис. 3**. Спектральні характеристики покриттів, отриманих термічним випаровуванням  $EuF_3$ : резистивне випаровування, nd = 0,80 мкм (1 – проба 3), електронно-променеве випаровування, nd=1,132 мкм (2 – проба 5).

(значення періодів граток  $\beta$ -EuF<sub>3</sub> в пробах 3 та 8 суттєво відрізняються, табл. 1). Покриття, яке отримано методом електронно-променевого випаровування (проба 5), містить суміш обох модифікацій EuF<sub>3</sub> (ромбічної та тригональної).

За даними рентгенівського фазового аналізу фаза  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> є основною фазовою складовою залишків від EuF<sub>3</sub> в човниках-випарювачах після нанесення з нього покриття (проби 2, 4, 7). Проте, крім неї, проби містять значну кількість флюоритоподібної фази EuF<sub>2+x</sub> як в кубічній, так і в тетрагональній формах (табл. 1). При цьому вміст цієї фази при заміні електронно-променевого випаровування на резистивне зростає.

Дані хімічного аналізу (табл. 2) свідчать про відсутність Eu (II) у спеченому зразку EuF<sub>3</sub> (проба 1). Плавлений же зразок (проба 6) містить досить помітну кількість Eu (II). Зразки EuF<sub>3</sub>, які зазнали високотемпературної обробки в процесі випаровування, містять значно більшу кількість Eu (II). Слід відзначити більш відчутний вплив на склад EuF<sub>3</sub> резистивного методу випаровування. При цьому різниця між вмістом Eu (II) в залишках з плавленого і спеченого зразків (проби 7 та 2) якраз відповідає різниці між вмістом Eu (II) у вихідних зразках.

Спектри дифузного відбиття тонкодисперсних порошків EuF<sub>3</sub> та залишків з нього після випаровування теж суттєво відрізняються один від одного (рис. 2). Так, на спектральній характеристиці спеченого зразка  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> (проба 1) проявляються лише гострі піки 4f-4f електронних переходів в іонні Eu<sup>3+</sup>, а на спектрі плавленого зразка  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> (проба 6) з'являється ще додаткова широка смуга поглинання, яка відповідає 4f-5d електронним переходам, характерним для іону Eu<sup>2+</sup> [7]. Для залишків після випаровування  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> зазначена смуга стає ще більш виразнішою, а піки, навпаки, В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, І.В. Стоянова та ін.

Вплив термообробки у вакуумі на оптичні властивості...

поступово слабшають при зростанні вмісту фази  $\mathrm{EuF}_{2^+ x}.$ 

Спектральні характеристики відбиття покриттів наведено на рис. 3. Значення оптичних та експлуатаційних параметрів покриттів (табл. 3) виявляють певну залежність від природи матеріалу та способу випаровування. Показник заломлення покриттів лежить в межах (1,5÷1,6), коефіцієнт розсіювання становить (0,03÷0,12) % і є найнижчим покриття, отриманого резистивним для випаровуванням спеченого α-EuF<sub>3</sub> (проба 3). Саме останнє покриття проявляє і найкращі експлуатаційні характеристики, особливо механічну міцність.

#### **IV. Обговорення результатів**

Сукупність отриманих в роботі даних свідчить про суттєві зміни у валентному стані Еи при жорсткій термообробці  $EuF_3$ . В умовах високих температур та вакууму відбувається часткове відновлення Eu (III) до Eu (II) за схемою:

 $2EuF_3 \xrightarrow{t, Vac} 2EuF_2 + F_2 \uparrow$ 

Термодинамічні розрахунки величини  $\Delta G^0_T$  цього процесу при  $T = T_{пл}$  (EuF<sub>3</sub>) та  $P = 10^{-3} \Pi a$  (вакуум у робочій камері) дають значення, близькі до 0, Підвищення температури приводитиме до того, що величина  $\Delta G^0_T$  набуватиме негативних значень. Крім того, слід враховувати, що процесові відновлення сприятиме стабілізація валентного стану Eu (II) у структурі EuF<sub>3</sub> за рахунок хімічної взаємодії утворення змішано-валентних сполук європію (наприклад, Eu<sub>2</sub>EuF<sub>7</sub>). Звертає увагу також більш значні зміни вмісту Еu (II) в EuF<sub>3</sub> (проба 6). Це пов'язане з тим, що він сам містить певну кількість іонів Eu<sup>2+</sup> у своїй структурі, тобто фактично є високотемпературним твердим розчином на базі  $\alpha$  - EuF<sub>3</sub>. Наявність фази EuF<sub>2+x</sub>, певно, є результатом розпаду високотемпературного твердого розчину на базі EuF<sub>2</sub>. Прослідковується досить чітка кореляція у зміні фазового складу і структурних параметрів тонкоплівкового покриття та залишку після випаровування порівняно вихідними 3

плівкоутворюючими матеріалами. Це ж стосується також взаємозв'язку між фазовим складом, вмістом Eu (II) та оптичними властивостями залишків після випаровування. Дійсно, зростання вмісту Eu (II) має призводити до посилення ролі 4f-5d електронних переходів і, отже – інтенсивності відповідної смуги поглинання. Що стосується оптичних властивостей покриттів, то значення  $\sigma$ , очевидно, залежить, у першу чергу, від структурної досконалості покриття і лише потім – від наявності Eu (II) в структурі EuF<sub>3</sub>, і тому їх значення не настільки однозначно пов'язані з валентним станом Eu. Не виключено, що Eu (II) відіграє певну стабілізуючу роль в формуванні структури і властивостей тонкоплівкових покриттів з EuF<sub>3</sub>.

#### V. Висновки

Отже, показано, що в процесі синтезу α-EuF<sub>3</sub>, виконаного в різних термічних умовах (спікання та плавлення), атоми в його структурі або упорядковано займають позиції структурного типу anti-Fe<sub>3</sub>C, або європій (II) частково заміщує Еи (III) в структурі EuF<sub>3</sub>. Термічна обробка в процесі вакуумного випаровування α-EuF<sub>3</sub> призводить до виникнення фази EuF<sub>2+x</sub>, що містить Eu(II) і є результатом термічної деструкції EuF3 в умовах високого вакууму. Склад EuF<sub>2+x</sub> та його вміст в зразку залежать як від вихідного матеріалу, так і від способу термічного випаровування. Тонкоплівкові покриття, отримані методом вакуумного випаровування, в основному містять високотемпературну фазу β-EuF<sub>3</sub>. Часткова зміна валентного стану Eu. яка відбувається у EuF<sub>3</sub> під дією термічної обробки у вакуумі, позначається на оптичних властивостях як самого матеріалу, так і отриманих з нього тонкоплівкових покриттів.

Цю роботу виконано при підтримці Науковотехнологічного центру в Україні (проект № 1356).

- **О.Г. Єрьомін** провідний інженер відділу фізико-хімії люмінесцентних матеріалів;
- *Н.М. Білявіна* кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник *кафедри фізики металів;*
- **В.Я.** Марків кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізики металів;
- **О.В.** Мозкова провідний конструктор лабораторії оптичних вакуумних покриттів.

**В.Ф. Зінченко** – доктор хімічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії люмінесцентних матеріалів;

*Н.П. Єфрюшина* – доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фізико-хімії люмінесцентних матеріалів;

*І.В. Стоянова* – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімії координаційних сполук і аналітичної хімії;

**В.П.** Антонович – доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фізико-хімії координаційних сполук і аналітичної хімії;

- [1] Г.В. Ионова, В.Г. Вохмин, В.И.Спицын. Закономерности изменения свойств лантанидов и актинидов, Наука, М., 240 с. (1990).
- [2] O. Greis. Über neue Verbindungen in den Systemen EuF<sub>2</sub>-EuF<sub>3</sub> und SrF<sub>2</sub>-EuF<sub>3</sub> // Z. anorg allg. Chem., 441, pp. 39-46 (1978).
- [3] O. Greis. Private Communication, (1976). Cyt. On "The Powder Diffraction File (PDF-2) (1993).
- [4] Н.П. Галкин, Я.Н. Туманов, Ю.П. Бутылкин. *Термодинамические свойства неорганических фторидов*. Справочник, Атомиздат, М. (1972).
- [5] V.Ya.Markiv, N.M.Belyavina, In: Proceeding of the Second International Scientific Conference of Engineering and Functional Materials, EFM-97, L'viv, pp. 14-16 (1997).
- [6] В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, Г.І. Кочерба, О.Г. Єрьомін, В.П. Соболь, О.В. Мозкова, В.Я. Марків, Н.М. Білявіна. Оптичні і експлуатаційні властивості тонкоплівкових покриттів, отриманих методом вакуумного випаровування фторидів РЗМ // Фізика і хімія твердого тіла, 2 (3), сс.351-360 (2001).
- [7] Д.Т. Свиридов, Р.К. Свиридова, Ю.Ф. Смирнов. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах. Наука, М., 266 с. (1976).

# V.F. Zinchenko<sup>1</sup>, N.P. Efryushina<sup>1</sup>, I.V.Stoyanova<sup>1</sup>, V.P. Antonovich<sup>1</sup>, O.G. Eryomin<sup>1</sup>, N.M. Bilyavina<sup>2</sup>, V.Ya. Markiv<sup>2</sup>, O.V. Mozkova<sup>3</sup>

### Influence of Thermal Treatment in Vacuum Upon Optical Properties of the Film Forming Material EuF<sub>3</sub>

 <sup>1</sup>A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAS of Ukraine, Lustorfska doroga, 86,Odesa,65080, Ukraine tel. 0482-61-82-25, E-mail: <u>physchem@paco.net</u>
<sup>2</sup>Taras Shevchenko National University, Volodymyrska Str., 60, Kyiv, 01003, Ukraine, tel. 044-266-23-35, E-mail: <u>belmar@mail.kiev.ua</u>
<sup>3</sup>Central Design Office "Arsenal", Moskovska Str., 8, Kyiv, 01010, Ukraine, tel. 044-254-59-08, E-mail: <u>borisgor@i.com.ua</u>

The influence of synthesis conditions on the stoichiometry, crystal structure and optical properties of europium trifluoride has been studied. The possibility of partial reducing of Eu(III) to Eu (II) during high-temperature treatment in a reducing medium and in a vacuum has been proved. The optical and operational properties of the thin–film coats prepared from the source  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> using thermal evaporation technique have been studied. The coat was shown to contain either  $\beta$ -EuF<sub>3</sub> or the mixture of  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub> and  $\beta$ -EuF<sub>3</sub> polymorphs depending on the preparation conditions.